

УТВЕРЖДАЮ

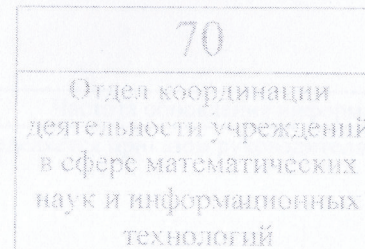
Заместитель руководителя
Федерального агентства научных организаций

24 ДЕК 2014



А.М. Медведев

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов
Российской академии наук
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов



ЧАСТЬ 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, очная форма обучения

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, получающие образование указанного уровня впервые

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: не установлены

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей объема государственной услуги					Источник информации о значении показателя
		2013	2014	2015	2016	2017	
Число обучающихся	человек	6	7	7	8	8	Соответствующая форма статистического наблюдения

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы".

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования	Состав размещаемой информации	Частота обновления информации
Размещение информации в сети Интернет	Условия оказания государственной услуги, режим работы Учреждения, справочная информация, контактные данные, порядок подачи жалоб и предложений, порядок оценки качества полученных услуг путём анкетирования.	Определяется приказом руководителя Учреждения

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- окончание срока действия лицензии организации;
- исключение государственной работы из перечня государственных работ;
- иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: не установлены

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля	Периодичность	Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием государственного услуги
1. Камеральная проверка	ежегодно	Федеральное агентство научных организаций
2. Выездная проверка	в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок	Федеральное агентство научных организаций

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

- ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

ЧАСТЬ 2

1. Наименование государственной работы: Выполнение фундаментальных научных исследований

2. Характеристика работы

Наименование работы	Единица измерения	Содержание работы	Планируемый результат выполнения работы				
			2013	2014	2015	2016	2017
Выполнение фундаментальных научных исследований	Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках проводимых фундаментальных научных исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0001 "40,43.1. Физические принципы создания элементной базы наноэлектроники, квантовых компьютеров и датчиков физических величин на основе новых свойств материалов и структур различной размерности, в том числе углеродных наноструктур.". Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направления 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника", 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)	8	8	9		
	Количество научных публикаций в	Тема (проект) № 0070-2014-0002 "40,43.2. Развитие				9	9

<p>рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках проводимых фундаментальных научных исследований (единиц)</p>	<p>элементной базы информационных систем на основе фундаментальных исследований новых свойств материалов и наногетероструктур, в том числе с элементами пониженной размерности.". Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направления 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника", 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)</p>					
<p>Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках проводимых фундаментальных научных исследований (единиц)</p>	<p>Тема (проект) № 0070-2014-0003 "40,43.3. Теоретическое и математическое исследование технологии, диагностики и функционирования приборов микро- и наноэлектроники, включая микро-, нано- электромеханические системы.". Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направления 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная</p>	5	6	6		

	электроника", 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)					
Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках проводимых фундаментальных научных исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0004 "40,43.4. Теоретические основы технологии и моделирование изготовления, диагностики и функционирования приборов микро- и наноэлектроники.". Содержание работы раскрыто в Плана научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направления 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника", 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)				6	6
Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках проводимых фундаментальных научных исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0005 "40.5. Исследование физических основ и разработка технологии элементной базы сенсорной наноэлектроники и наноструктур СВЧ и ТГц диапазонов.". Содержание работы раскрыто в Плана научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии	1	1	2		

	<p>микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направление 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)</p>					
<p>Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках проводимых фундаментальных научных исследований (единиц)</p>	<p>Тема (проект) № 0070-2014-0006 "40.6. Физические и технологические основы сенсорной наноэлектроники и приборов ТГц диапазона.". Содержание работы раскрыто в Планах научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направление 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)</p>				2	2
<p>Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках проводимых фундаментальных научных исследований (единиц)</p>	<p>Тема (проект) № 0070-2014-0007 "43.7. Физико-химические основы перспективных технологий формирования приборных структур наноэлектроники, нанофотоники и энергетики на базе атомных, молекулярных, ионных пучков и плазмы.". Содержание работы раскрыто в Планах научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники</p>	2	2	2		

	и обособистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направление 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)					
Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках проводимых фундаментальных научных исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0008 "43.8. Развитие нанотехнологий наноэлектроники, нанофотоники и энергетики на базе высокоэнергетичных концентрированных пучков ионов.". Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и обособистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направление 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)				2	2
Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках проводимых фундаментальных научных исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0009 "40,41,43.9. Разработка физико-химических основ материаловедения, технологии и диагностики материалов и структур микро- и наноэлектроники, микросистемной техники, акусто- и оптоэлектроники и микрофотоники.". Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и обособистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направление 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)	30	31	32		

	<p>наук на 2015 - 2017 годы. (Направления 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника", 41 "Опто-, радио- и акустоэлектроника, оптическая и СВЧ-связь, лазерные технологии", 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)</p>					
<p>Количество научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных журналах в рамках проводимых фундаментальных научных исследований (единиц)</p>	<p>Тема (проект) № 0070-2014-0010 "40,41,43.10. Получение новых перспективных материалов, развитие методов диагностики материалов и структур микро- и наноэлектроники.". Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направления 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника", 41 "Опто-, радио- и акустоэлектроника, оптическая и СВЧ-связь, лазерные технологии", 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)</p>				32	32

Количество исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0011 "Проект 1: Электронные кинетические свойства и многочастичные эффекты в низкоразмерных системах на основе графена Программы 20П «Квантовые мезоскопические и неупорядоченные структуры». ". Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направление 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)		1			
Количество исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0012 "Проект 2: Туннельный транспорт и фотоэлектрические явления в AlGaAs/InAs гетероструктурах с квантовыми точками Программы 20П «Квантовые мезоскопические и неупорядоченные структуры». ". Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направление 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника" программы		1			

	фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)					
Количество исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0013 "Проект 3: «Влияние взаимодействия частей мезоскопических сверхпроводящих структур на их состояние» Программы 20П «Квантовые мезоскопические и неупорядоченные структуры».". Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направление 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)		1			
Количество исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0014 "Проект 4: «Исследование связанных мезоскопических сверхпроводниковых структур» Программы 20П «Квантовые мезоскопические и неупорядоченные структуры».". Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направление 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная		1			

	техника, твердотельная электроника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)					
Количество исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0015 "Проект 5: «Сильно коррелированные электронные системы» Программы 20П «Квантовые мезоскопические и неупорядоченные структуры».". Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направление 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)		1			
Количество исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0016 "Проект 1: «Транспортные свойства высокоподвижных и многослойных структур на основе графена» Программы 24П «Фундаментальные основы технологий наноструктур и наноматериалов».". Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направления 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и		1			

	микросистемная техника, твердотельная электроника", 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)					
Количество исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0017 "Проект 2: «Однофотонные детекторы и ячейки оптической памяти на основе полупроводниковых наноструктур с квантовыми точками» Программы 24П «Фундаментальные основы технологий наноструктур и наноматериалов».». Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направления 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника", 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)		1			
Количество исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0018 "Проект 3: Электромагнитные свойства изотропных метаматериалов, обусловленные индивидуальными резонансами Ми и пространственно-групповыми резонансами Программы 24П «Фундаментальные основы технологий наноструктур и		1			

	<p>наноматериалов».». Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направления 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника", 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)</p>					
<p>Количество исследований (единиц)</p>	<p>Тема (проект) № 0070-2014-0019 "Проект 4: «Получение легированных наностержней ZnO n- и p-типа» Программы 24П «Фундаментальные основы технологий наноструктур и наноматериалов».». Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направления 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника", 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы</p>		<p>1</p>			

	фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)					
Количество исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0020 "Проект 5: «Наноструктурированные материалы водородной энергетики» Программы 24П «Фундаментальные основы технологий наноструктур и наноматериалов». Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направления 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника", 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)		1			
Количество исследований (единиц)	Тема (проект) № 0070-2014-0021 "Проект: «Композитные материалы на основе резонансных дискретных структур для разработки оптической элементной базы гетерогенных телекоммуникационных систем» Программы 2 ОНИТ «Научные основы создания гетерогенных телекоммуникационных и локационных систем и их элементной базы». Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии		1			

	<p>микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направление 43 "Нанотехнологии, нанобиотехнологии, наносистемы, наноматериалы, нанодиагностика, наноэлектроника и нанофотоника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)</p>					
Количество исследований (единиц)	<p>Тема (проект) № 0070-2014-0022 "Проект: «Исследование возможности использования новых квантовых эффектов в мезоскопических структурах, для создания элементной базы квантовых компьютеров, наноэлектроники и микросистемной техники» Программы 3 ОНИТ «Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, микросистемная техника»". Содержание работы раскрыто в Плате научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направление 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)</p>		1			
Количество исследований (единиц)	<p>Тема (проект) № 0070-2014-0023 "Проект: «Фундаментальные проблемы физики и технологии гетерозпитаксиальных туннельных F-D-F наноструктур с гигантским</p>		1			

		<p>магниторезистивным эффектом для передовых ячеек магнитной памяти и микроволновых излучателей» Программы 5-ОИ «Фундаментальные проблемы физики и технологии эпитаксиальных наноструктур и приборов на их основе». Содержание работы раскрыто в Плане научно-исследовательских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук на 2015 - 2017 годы. (Направление 40 "Элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, материалы для микро- и наноэлектроники, нано- и микросистемная техника, твердотельная электроника" программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.)</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной работы из перечня государственных работ;
- прекращение Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы).

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля	Периодичность	Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением государственного задания
1. Выездная проверка	в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок	Федеральное агентство научных организаций
2. Камеральная проверка	годовая	Федеральное агентство научных организаций

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

- устанавливается регламентом взаимодействия Федерального агентства научных организаций и федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по подготовке и предоставлению научными организациями, подведомственными Федеральному агентству научных организаций, отчетов о выполнении плана научно-исследовательских работ (далее - Регламент).

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

- в соответствии с Регламентом.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

План научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук на 2015-2017 годы